

卓上型走査電子顕微鏡（元素分析機能付）

卓上型走査電子顕微鏡

【装置概要】

試料への電子線照射によって得られる反射電子や二次電子を検出することで、試料を拡大観察する装置です。低真空観察法により、導電性の無いセラミックスや、生体試料も前処理なしで観察可能です。

製造者	(株)日立ハイテクノロジーズ
型式	TM4000 Plus
加速電圧	5kV、10kV、15kV
画像信号	反射電子、二次電子、合成
最大試料サイズ	Φ80mm×50mmt



エネルギー分散型X線分析装置（EDS） ※ 2021年度JKA補助事業

【装置概要】

試料への電子線照射によって励起された特性X線を検出し、拡大観察中の領域に存在する元素の種類やその組成比を分析することが可能です。

【特徴】

●リアルタイム解析

着目箇所の元素情報をリアルタイムで表示することができます。

●高精度元素分析

ピーク位置が近接した元素も分離可能です。

【分析モード】

スポット分析、ライン分析、マッピング分析

製造者	Oxford Instruments
型式	AZtecLiveOne Xplore
検出可能元素	B ₅ ~U ₉₂



マッピング分析例

クールステージ ※ 2021年度JKA補助事業

【装置概要】

試料台をペルチェ素子で冷却することで、含水試料や電子線照射に弱い試料も分析可能です。

製造者	DEBEN UK Ltd.
型式	クールステージ MK-3型
冷却温度	-20℃ ~ 50℃



ペルチェ素子内蔵
クールステージ